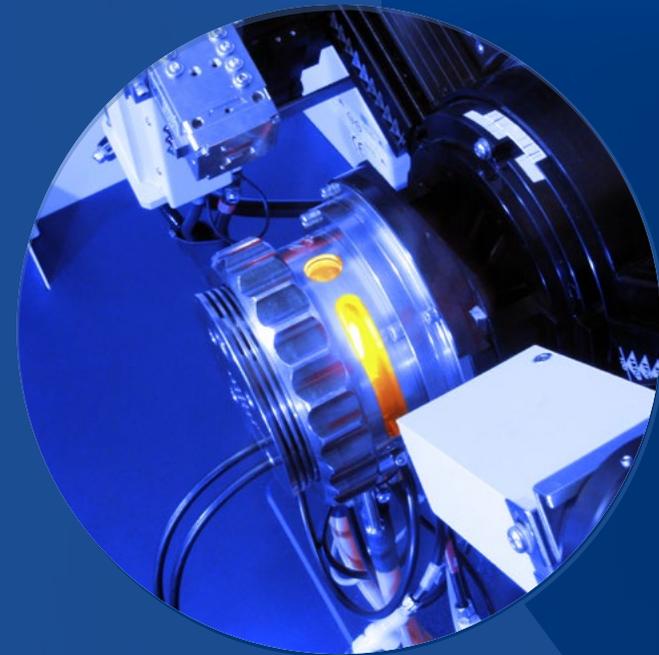


We Innovate Materials

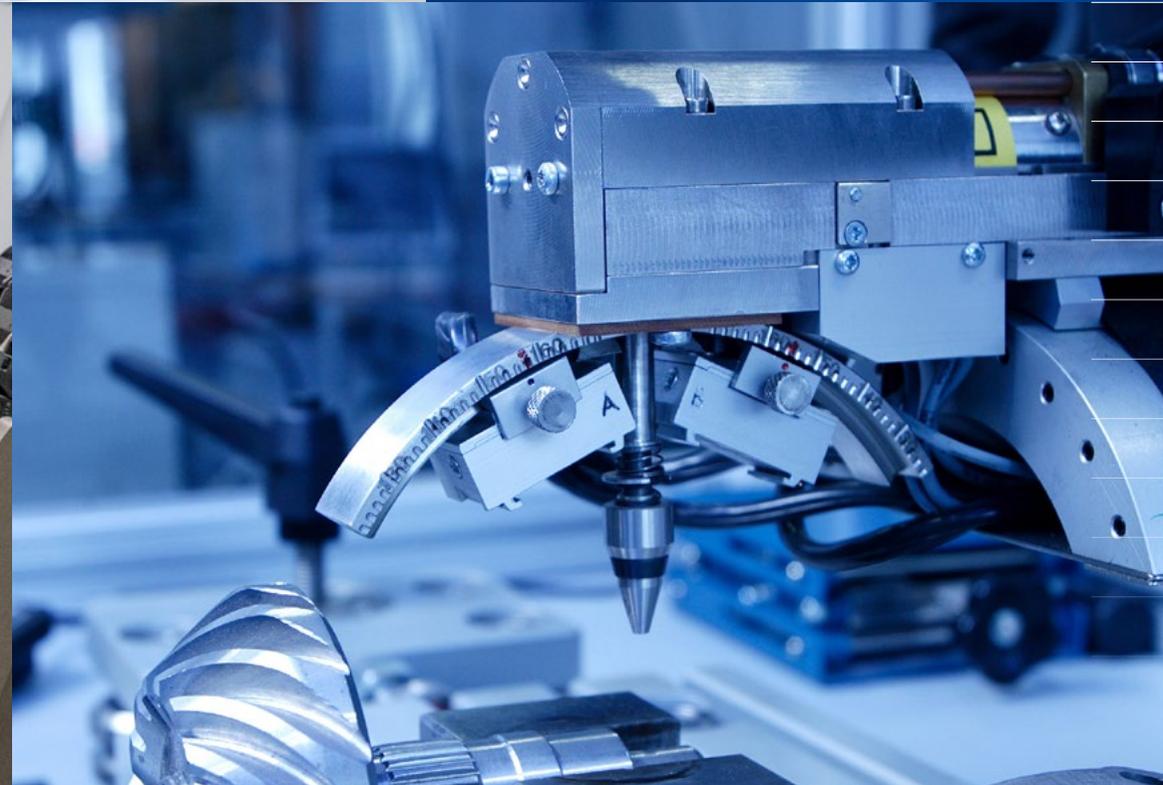
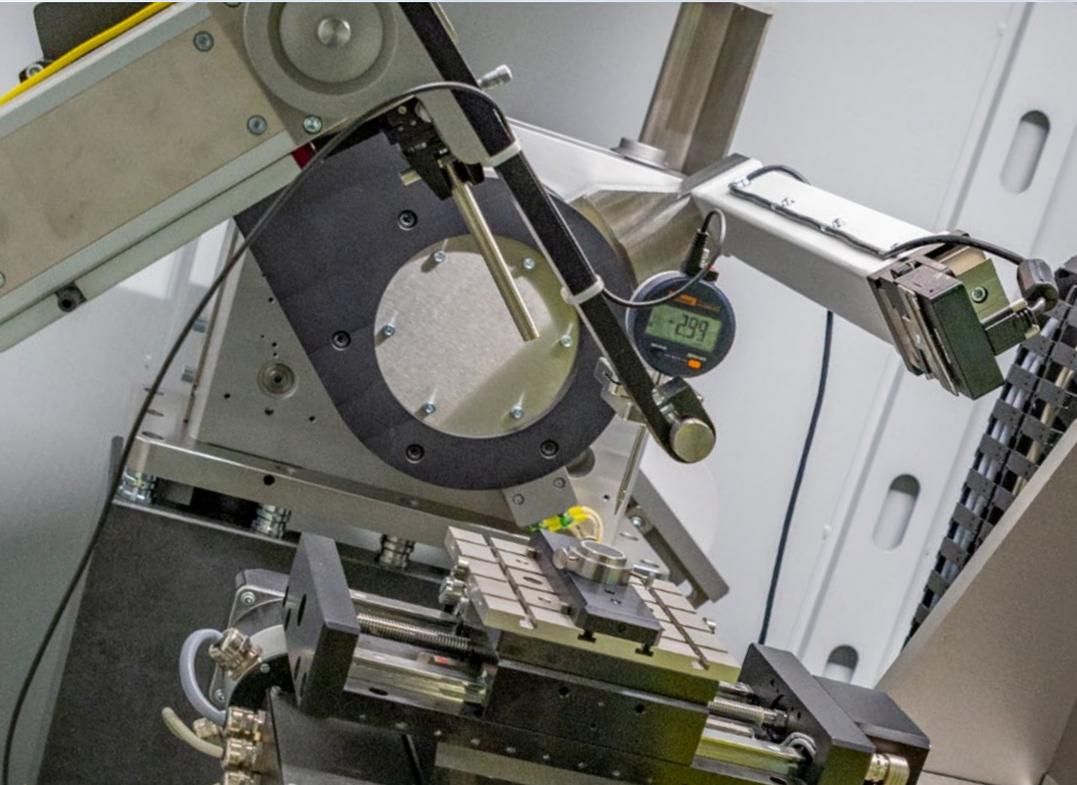
Qualitative und quantitative Phasenanalyse
Hochtemperatureigenschaften und Phasenumwandlungen
(Röntgenographische) Eigenspannungsmessungen

Struktur- und Phasenanalyse Röntgendiffraktometrie



KOMPETENZ & ZUVERLÄSSIGKEIT

Qualitative und quantitative Phasenanalyse



Röntgenographische Bestimmung von Phasenaufbau und Strukturparametern bei Raumtemperatur

(teilweise im Rahmen der Akkreditierung nach EN ISO 17025)

Ansprechpersonen



Ing. Robert Peissl
T +43-676 848883 103



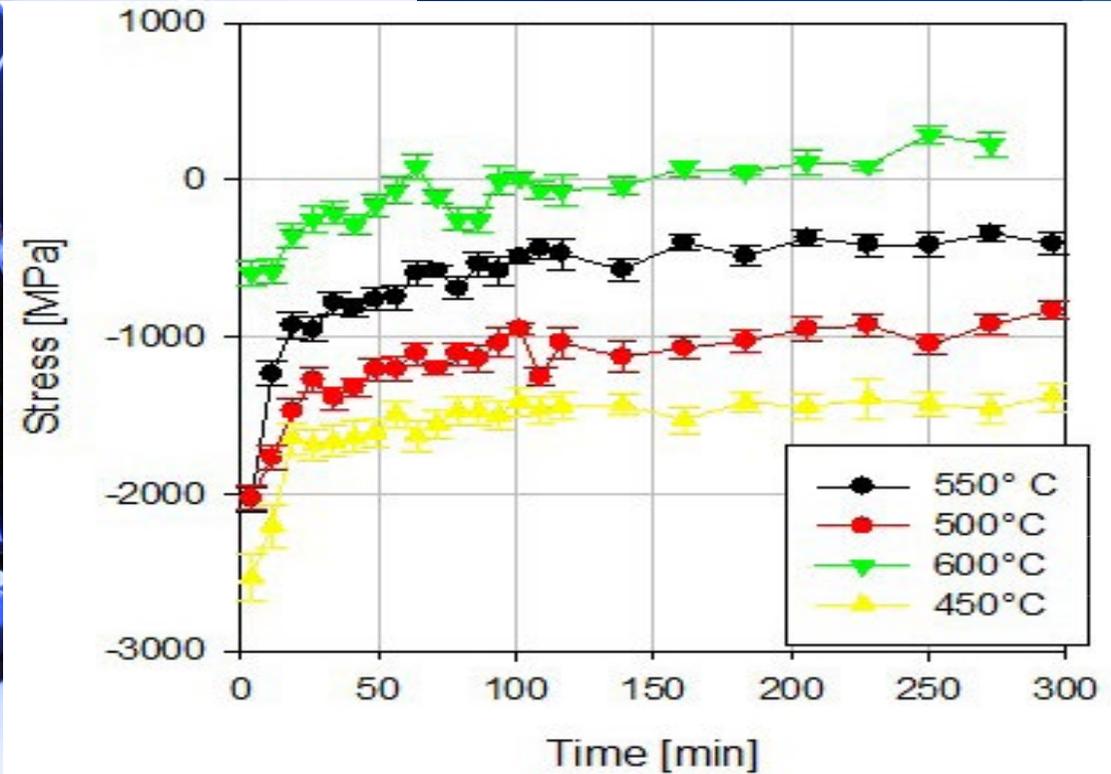
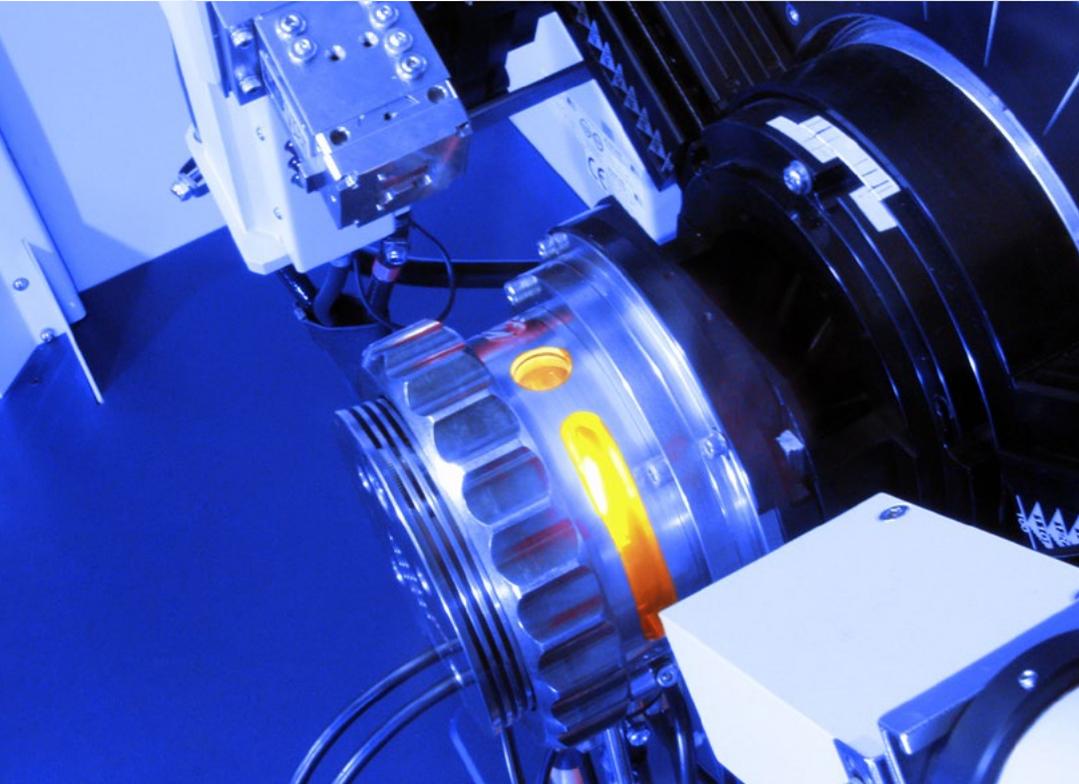
Dr. Stefan Marsoner
T +43-676 848883 102

We Innovate Materials

Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

- Qualitative und quantitative Phasenanalyse (inkl. Rietveldmethode)
- Ermittlung Gitterparameter (Gitterkonstanten, Defektdichte, Kristallitgröße)
- **Bestimmung des Restaustenitgehaltes** nach ASTM E 975 (im Rahmen der Akkreditierung) oder mittels Rietveldmethode (Labor und vor-Ort)
- Analyse von Welligkeiten, Reflektometrie z.B. an mikroelektronischen Bauteilen
- Untersuchung von Metallen, Keramiken, Beschichtungen

Hochtemperatureigenschaften und Phasenumwandlung



Bestimmung von Phasen, Phasenumwandlungen, Strukturparametern und Eigenspannungen bei erhöhten Temperaturen sowie unter verschiedenen Atmosphären.

Ansprechpersonen



Dr. Paul Angerer
T +43-676 848883 135



Dr. Stefan Marsoner
T +43-676 848883 102

We Innovate Materials

Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

- Bestimmung von kristallographischen Strukturparametern als Funktion der Temperatur
- Bestimmung von Phasenumwandlungen wie z.B. magnetische Umwandlungen und Gitterumwandlungen, Schmelz-, Glasübergangstemperaturen
- Verfolgung von Phasenänderungen infolge von Glühprozessen
- Detektion von Phasenreaktionen (z.B. Oxidation, Zersetzung)

(Röntgenographische) Eigenspannungsmessungen



Röntgenographische Bestimmung von Eigenspannungen.
(teilweise im Rahmen der Akkreditierung nach EN ISO 17025)

Ansprechpersonen



Ing. Robert Peissl
T +43-676 848883 103



Dr. Stefan Marsoner
T +43-676 848883 102

We Innovate Materials

Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

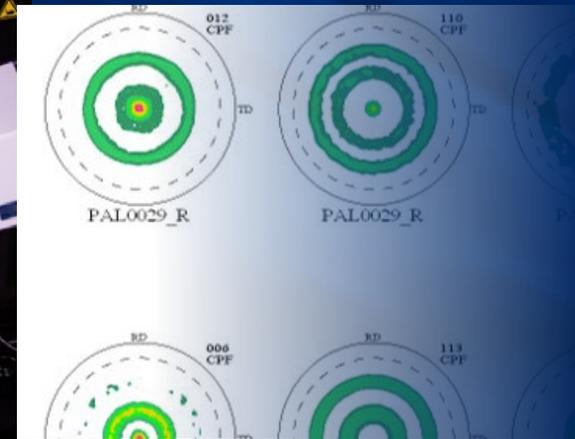
- Röntgenographische Ermittlung von Eigenspannungen, Eigenspannungsverteilungen und -tiefenprofilen an Bauteilen im Labor oder beim Kunden vor Ort (nach EN 15305 im Rahmen der Akkreditierung)
- Eigenspannungsentwicklung in Schicht/Substratverbunden bei Temperaturwechseln
- Bestimmung der Relaxation von Eigenspannungen bei erhöhten Temperaturen bis 900°C
- Ermittlung der Eigenspannungen mittels Cut-Compliance-Verfahren

Leistungsangebot

- Qualitative und quantitative röntgenographische Phasenanalyse (Raumtemperatur bis 1400°C)
- Ermittlung von Gitterparameter (Gitterkonstanten, Defektdichte, Kristallitgröße) als f(T)
- Bestimmung von Phasenumwandlungstemperaturen
- Röntgenographische Phasen- und Strukturanalyse von dünnen Oberflächenschichten
- Bestimmung von Fasertexturen in Schichtsystemen
- Bestimmung von Welligkeiten, Reflektometrie an mikroelektronischen Bauteilen
- Ermittlung von Eigenspannungstiefenprofilen an Proben und Bauteilen
- Chemische Analyse mittels RFA
- Messungen im Labor oder Vor-Ort an großen Bauteilen, Komponenten oder Werkstoffen

Prüfungen im Rahmen der Akkreditierung:

- Bestimmung des Restaustenitgehaltes nach ASTM E 975 (akkreditiert) bzw. Rietveld-Methode
- Röntgenographische Bestimmung von prozessbedingten Eigenspannungen nach EN 15305 (akkreditiert)



KOMPETENZ & ZUVERLÄSSIGKEIT

Anlagenausstattung

- Röntgendiffraktometer Bruker D8 Discover mit ultrapräzisem Atlas-Goniometer und einer großen Anzahl an Anodenmaterialien, Detektoren und Aufbauten für verschiedene Anwendungen (u.a. Hochtemperaturkammer HTK2000 von Fa. Paar für etektion schneller Phasenumwandlungen in inerter und oxidischer Atmosphäre (25 bis 1400°C)
- Röntgendiffraktometer Bruker D8 Discover mit Eulerwiege für Textur-, Eigenspannungs- und Phasenanalysen.
- Röntgendiffraktometer Seifert Charon SXL (XRD Eigenmann GmbH): Diffraktometer für große Bauteile für hochpräzise Messungen mit einer Spotsize bis 50µm
- Mobile Röntgendiffraktometer Stresstech Xstress 3000 (G2/G3) mit integrierter Tiefenmessung und automatischem Prüftisch. Geeignet auch zur Messung von innenliegenden Flächen und zur Insitumessung an Prüfmaschinen.
- Mobiles Röntgenfluoreszenzanalysegerät S1TurboLE von Bruker (Handheld)

